AVAILABLE COPY

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-000783

(43) Date of publication of application: 06.01.1992

(51)Int.Cl.

B018 3/18

(21)Application number: 02-152819

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22) Date of filing:

13.06.1990

(72)Inventor: KAYANE NAOKI

SAKANO SHINJI OKA SATOHIKO **UOMI KAZUHISA**

OTOSHI SO

TSUCHIYA TOMONOBU

OKAI MAKOTO

(30) Priority

Priority number: 01149603

Priority date: 14.06.1989

Priority country: JP

01224463 02100308

01.09.1989 18.04.1990

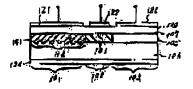
JP JP

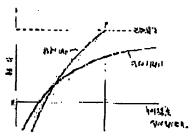
(54) SEMICONDUCTOR OPTICAL ELEMENT

(57) Abstract.

PURPOSE: To stably oscillated light of a desired wavelength by differentiating the differentiation gain coefficient for an injected carrier density of a gain active layer oscillated through amplification of a light having a specific wavelength from that for a light amplifying active later.

CONSTITUTION: A phase regulating region 102 having an optical waveguide 181 in which a refractive index is reduced upon increasing of injected carrier density and a light amplifying region 103 made of an active optical waveguide 105 having a second active layer structure are provided. When a material having shorter wavelength of the wavelength AP2 of a gain peak than a laser oscillation wavelength AL is used as an active waveguide 141, the wavelength λP2 does not coincide with the wavelength AL in the material having the short wavelength $\lambda P2$ at a gain peak. Accordingly, a gain gradient becomes smooth, and





even if carrier density is increased, an increase in a photon density is suppressed, a reduction in carrier density upon inductive emission depending upon the photon density is suppressed to increase the carrier density. Therefore, a region 101 does not reach a gain to self-oscillation, and a wavelength variable width and particularly Bragg's reflection

wavelength can be increased.

[Date of extinction of right]

LEGAL STATUS

1. Dec. 2005 17:29

[Date of request for examination] [Date of sending the examiner's decision of rejection] [Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration] [Date of final disposal for application] [Patent number] [Date of registration] [Number of appeal against examiner's decision of rejection) [Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

19 日本国特許庁(JP)

00 特許出頭公開

◎ 公開特許公報(∧) 平4-783

Dint. Cl. H 01 B 3/18 越別記号

庁内整理部分 6940-4M ❸公開 平成4年(1992)1月6H

香査請求 未請求 請求項の数 50 (全22頁)

図発明の名称 半導体光素子

> 取 平2-152819 **20**47

図出 顧 平2(1990)6月13日

❷平1(1989)6月14日❷日本(JP)⑩特頭 平1−149603

優先権主張 個先 明 者 唐 樹

東京都国分寺市東亚ケ區1丁目280番地 株式会社日立製 作所中央研究所内

個発明 者 板 野 冶 東京都国分寺市東恋ケ塞1丁目280番地 株式会社日立起

作所中央研究所内

仓発 眠. 東京都国分寺市東亞ケ孫1丁目280番地 株式会社日立製

作所中央研究所内

切出 頭 人 林式会社日立魁作所 東京都千代田区神田駿河台4 1 目 6 番地

四代 理 人 弁理士 小川 腺男 外1名

最終頁に続く

- 1、発明の名称 年 辱 体 光 杀 子
- 2. 特許超求の盟囲
 - 1. 光学的に結合しキャリアの住入により科詩の 変化を生じる複数の活性層を含む複数の半導体 領域であって、往入された中々リアにより光を 政出するための治増経活性層を含む増幅機成と この光増額倍性層により放出された光を厚較す るための利得活性層及び基波する光を帰還する ための分布帰退構造を含むDBR領域とを有す るものと、これら重数の半導体領域にキャリア を姓入する手段と、上記光増調活性層が放出す る光のうち特定の放長を有する光を上記分布帰 准線造により選択的に併選することにより上部 特定彼長を有する光を増幅して発風するための 共振の構造とを有し、上記科特活性層の有する 住人キャリア密度に対する地分科協係数を上記 光増幅活性層の右する姓入キャリア密度に対す る敵分利得係敵とは其ならせた単語体レーザ数

- 前記光増額括性層を構成する半導体材料と、前 記利特徴性層を構成する学塩体材料とが、異な 3 半等体材料である半導体レーザ報酬。
- 3、 韓水項 1 に記載の半速体シーザ装置において、 前記複数の活性層は妻子共戸建造を有する単ぽ 依レーザ真量.
- 4. 請求項1 に記載の半導体レーリ製量において、 前記利侵替住屋の報分利将係取が削記光均層領 性層の限分科特徴数より小さい半導体レーザ装 ▦.
- 5.請求項上に記載の単導体レー学設置において、 前記位相震節領域は能動的学導体材料により形 成されている光を伝説するたのの光度放用を有 する平準体レーザ衰墜。
- 6. 買求項6に記載の半速なレーザ装置において 前記位相響節領域は前記共復者の光路長を変化 させるための電優を有する半導体レーリ数型。
- 7.請求項5に記録の単導体レーザ製量において、

特別平 4-783 (7)

破域には液を発すことにより生じる現实を確成するだけの利得をPRR級域に特たせることが必要となる。使ってこの吸収扱矢が大きくなると。これを制度させようとする結果、DBR級域が自身の利得により自己発掘を起こしてしまうという扱本的な問題がある。既还した位相関節領域で発生する吸収の規率的な協会にはならない。

また。这長テャ ピングを押さえた収録用レーザにおいては、佐長テャーピングを低級するために、バイアス条件や光出刀の選択の範囲がいさおい小さくなってしまう。この創設は更に高速特性をも拘束するという問題がある。

本発明の目的は、上記能飛技術の有する技術的 課題を解決し、所望の放長を安定に発展する半部 体レーザ観異を提供することに有る。

また、本発明の他の目的は、上記のように吸収や利料による制度を取り除さ、より大きな屈折準要化権を有する半等体レーザ製度を提供することに有る。

特所性層の有する許入キャリア病度に対する数分 利特係数を上記光増板機性層の有する権入キャリ ア密度に対する数分利特係数とは異ならせた単導 体レーザ質度が提供される。

本発明でいう合性層とは、利得が1より大きいとは、ある は長の光に対し物飲め、すなわち増幅機能が存在 することを意味する(従って利格が1以下という 場合には受助的、すなわち光の強度が一定のよう 変化しないか、着しくは強収されて光の損失が生 じることを意味する)、本発明は、このような特 性質を複数有する。

されらの活性層の、社入キャリア由皮の対する 物分利待係数を異ならせることが、本見明の1つ の特徴である。このな分利特係数とは、注入キャ リア由皮の酸化量に対する利相の変化量のことで ある。数分利特係数に発展を設けることにより、 少なくとも1つの活性層においては自己発展が生 じないようにすることが可能となる。数分利特係 数に発展を設けるためには、例えば活性層を構成 本発明の更に他の目的は、複数の街性層のうち 1部の活性層へのキャリア件入による利特係数の 増加を小さく抑えることにより、大きな数長可変 幅が得られ、増しくは通訊数長による発類出力の 型化が小さい半導体レーザ機関を提供することに ある。

【護師を解決するための手段】

する単連体材料、若しくは指性層を提成する化合物半速体の元素組成を変えることにより、 当た、 量子 井戸 構造に代表されるように活性層の厚さに 変化を取けることによっても変現される。 これらの 変化は 再結合 発光する 電子と正孔の エネルギー 登. すなわちパンドギャップ 殺しくせ 爰子 井戸 多水 立る 活性層内の電子と正孔の エネルギー 状態の 差に 起因する。 微分利 特系数 が小さい 活性 層に おいて自己 発 低が押さえられるたの。 この 信性層 か形成される 領域を DBR 個域とする。

生た、本発明における複数の活性層、すかわら、また、大学のでは、 1000 では、 1000

特閒平 4-783 (8)

証、君しくは時のとなっている。この情報をは、 ととなっている。このは、 とははなったののは、 とははなったののでは、 とはなったののでは、 ののでは、 のでは、 のでは、 のでで、 のでは、 のでは、 のでは、 のででは、 のででは、 のででは、 のででは、 のででは、 のでででは、

半部体レーザの発出は長の設定は、共盛器内の 風折率と一部領域において変化させることにより 行うか、この一部領域は気が分布する領域内に設 けられた分布得速構造の着合がある。分布将連構 連は一般にはグレーティングを形成した半導体上 に異なる屋折率を有する半導体を経暦したもので、 風術率の周期的分布を形成したものである。

また、本発明の他の1周回によれば、異なる利 得ピーク収受を有する複数の活性層と、これらの 利格ピーク波長とは異なる特定の数長を有する光 を選択的に帰還することにより上記符定波長を有 する光を均衡して免徴するための共通器とを有す る半適体レーザ算型が開示される。免扱波長を、 活性層の特殊を最大にする波長(利得のピーク接 長)からずらして設定することに本発明の1つの 特徴がある。

本契明の更に他の1月間によれば、光学のに結構 会しキャリアの注入により利得の変化を生じら複数 の指性限を含む複数の話性伝統と、これとに複数 の活性限域にキャリアを注入する手段を有する光を 位用が放出することにより上記特定被反を有する が発表して発想であるための共級時候とを有す る光を増殖して発想をひ上記結性層がキャリア る光を増殖して発想をひ上記結性層がキャリア る光を増殖して発想をひ上記結性層がキャリア る光を増殖して発想をひ上記結性層がキャリーク の表数的に基づく風折率の変動を相互に補償と りにした半導体レーザ装置が提供される。

相互に補償するためには、上記複数の活性層と して利得のピーク波長が異なるものを用いる。 これらのピーク波長の間に発極波長を設定すること により、キャリアの密度変動に伴う舌性層の展派

半窓化を上記複数の活性層間で相互に相殺して放 をチャーピングを低級することが可能となる。

上記いずれの場合も、複数の話性層のうち少なくとも一つの話性層が固約格子(分布局違接後)の近便に配置されていることにより、固价格子的分の損失の発生を助ぐことができる。特に「近時に配置されている」とは、その話性層と回訳格子が並行に重かるように配置されていることを意味する。

また、本発明の更に他の局面によれば、DBR 領域へのキャリア注入による判例の増加を小さく 抑えるために、判得ピーク仮長が発無波炎より短 彼長頃にある材料を、このDBR領域を課成する 活性層に用いた単導体レーザ装置が延供される。 (作用)

まず、本見明の原理のよっを図面を用いて説明 する。本元明を被長可変レーザとして構成したものを第1回に、更にこの中に用いられている活性 層のキャリア密域に対する利場と再択事数化を第 3 A 図及び第3 B 図に示し、これもを用いて説明 ٦ŏ.

レーザ発掘は、DBA領域101の回折格子による反射と光増額領域103例の期間120からの反射で共極値を形成し、光増積銀版101に電路123を介して電流性入したとま年ずる大きな利特により行われる。発級放展を快速するのは、

DBR領域101のブラッグ反射被長領域内の被 長であると同時に共通器内で1位値する位相が2 ェの整数倍を測たす彼長である。

さて記込した特別的84-49283 号会権に記載の 例では、この1 図に対応とせて説明すると、DBR 図は1 0 1 の活性認故路1 4 1 に往入電流は記 利場の大きい光均ののときの中・リアな過 では、2 のの発性のでは、対し 利場の大きい光均ののときの中・リアなる 利得、及び息折率変化の関係を2 人名 2 にはる に示する。 は性材料の利じークなうにはる。 で では、2 のとははる。 ここのため、10 で のため、レーザ発射をは増加する。 はなって、DBR のため、アる利特は危険に増加する。 分布帰還と のため、アる利特は危険でする。 かお帰還と のため、アる利特は危険でする。 かお帰還と のため、アる利特は危険でする。 かお帰還と のたり、2 への息取 のに対する。 になる、2 で のたが前距を受けることになる (2 2 に)。

これに対し、DBR 領域101の後性光導波路 141に光煙循環域105の活性症波路105と は性入ウィリア密度に対する利特変化(総分利得

一致しないため、利得の取がゆるやかになる、このため、キャリア密度を増大(性入電流を増大)をせても、中ャリア治皮の増大にともなう光子密度の増加が抑えられ、更に光子密度に依存する所以放出に付続するキャリア南皮の健少が抑えられてキャリア密度の増大が得られる、他って、DBR 信敬101が自己発調するだけの利料に違しない。このため、最新学習化を生じさせるキャリア帝皮

が固定されず、有効に利用できる。さて、キャリア国家の変化による最新率の変化は、被長に対して破やかにして変化しないため、利得ピークが短波長1P。におけるキャリア国皮の変化による最新率変化は、利待ビークにある第1の活性層よりは多少劣るが、関係をとる。このため、波長可変値、特にブラック反射致長の可変値を大きくとることができるようになる。

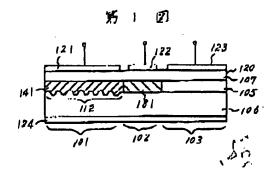
上記のように、ひちと領域に光増関領域よりも キャリア密度に対する刺絡を少なくすることによ り、光増超領域の発怒しるい運電銀の増大を押さ えながら広い波長可旋伸性を得ることができる。

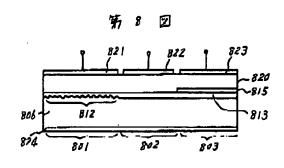
位相回路に関しては、位相同即領域102へ遺 流性人を行ない、ブラッグ反射線とへも開発団 120間のレーザ光の競モード共振条件に位相を 合わせることにより、広い放長範囲にわたり早ー モード状態で連続的に発掘放長をレフトさせるこ とが可能となる、また、独入ヤャリア由度の変化 による初得変化が平地化するので、発展破長をシ フトさせた時の更越出力の数化が低減するという 効果がある。

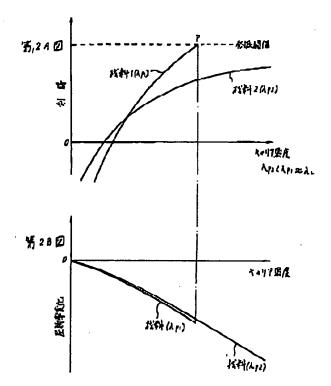
さらに、光増模様は103を構成する活性な光 返該番105の材料として、発掘時の利得ピーク 波長が発強被長より長いものを用いることにより、 発制被長を利得ピーク波長より解波長波に戴護することができる。この散胸により、キャリア曲反 のゆらぎに伴う屈折中の変化と利得の変化の比、 いわゆるなパラメータが小さくなるため、スペクトル級値が小さくなる。

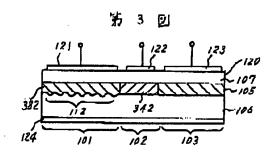
第8回により、本発明の別の原理を提明する。 図中、第1型と同一等等のものは、同一等成を扱わす、第1型のじおは知識と位相関節領域の光導体時間 2000年以来を位相関節領域の光導体時間 2000年以来を使用のかは、01に受動的で中 マリアを性入すると最新なが減少する光端を 外域を自342を用いる。これにより、健康、受 始めな位相関節領域で生じていた中マリアの増加 に行う数収扱矢の増大を置くすことが出来る。但

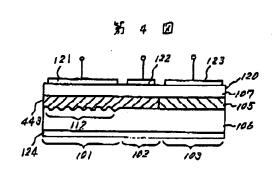
特閒平 4~783 (18)

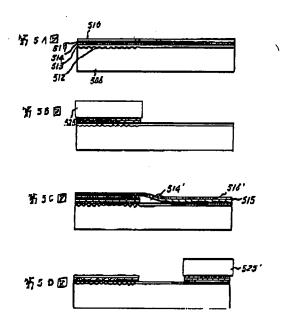












This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

| Defects in the images include but are not limited to the items checked: |
|---|
| BLACK BORDERS |
| ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES |
| ☐ FADED TEXT OR DRAWING |
| BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING |
| ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES |
| COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS |
| GRAY SCALE DOCUMENTS |
| ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT |
| ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY |
| □ OTHER: |

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.